

32998-1

# 微型计算机

## Microcomputer

INTEL

微型计算机系列器件手册

(上 册)

(43)

1983

上海交通大学

# 微型计算机(内部丛刊)

总 33 期

1983 年 第 4 期

---

编辑：上海交通大学微型计算机研究室

出版：上海交通大学科技交流室

发行：上海交通大学科技交流室

印刷：上海市崇明县裕安晨光印刷厂

---

一九八三年十二月出版

（内部发行）

TP36

110/1

## 前　　言

自1971年美国INTEL公司研制出单片的四位微处理器以来，已经有十多年的发展历程。随着大规模集成电路工艺的迅速发展，品种日趋增多，性能也日臻完善。因此，微型计算机不仅在各个领域获得了广泛应用，而且微处理器本身不断更新换代，目前已渗入到小型机的应用领域，并有大规模推广应用的趋势。

微型计算机之所以能如此迅速发展，并得到广泛应用，除价格低廉，性能日益提高外，还因为它具有体积小，灵活性大，适应性强等特点，因此值得重点介绍，并努力促进新产品新技术的开发和应用。

为早日实现四个现代化，使广大技术人员尽早地掌握和应用这一先进技术，我们翻译出版了1982年版本的INTEL系列器件手册。本手册既可供广大从事微型计算机开发、研制和应用的人员使用，也是高等院校、研究院所等单位师生和科技人员的参考工具书。

手册共十四章，分上、中、下册出版。第一章：随机存贮器；第二章：只读存贮器；第三章：磁泡；第四章：电话和信号处理；第五章：HMOS单片8位微计算机；第六章：MCS-48<sup>TM</sup>系列单片微计算机；第七章：MCS-80/85<sup>TM</sup>系列微计算机；第八章：iAPX 86,88系列微计算机；第九章：微计算机外围器件；第十章：iAPX432微主机系统；第十一章：工业级产品；第十二章：军级产品；第十三章：质量保证；第十四章：通用信息。其中第十一、十二章是INTEL系列的工业级系列和军级系列产品，除环境条件考核性能比民用产品优越外，逻辑功能和使用方法与民用系列产品完全相同。本书为减少篇幅，只列出了其中的产品目录。

参加本手册翻译工作的有上海交通大学计算中心杜毅仁，唐长钧，赵正校，陈永乐，谢康林，朱煜清，韩朔瞭，李世祥，杨辰圆，杨克忠，王洪澄，金树福，王明芳，夏雨仁，袁哲豫，徐子亮和广西南宁市电子学会张寿天，项湜伍，肖普隆，龙吉田，曹锦章，桂建安，张匡华，梁平，李包成，钟丽新，金字谱等同志。全书由杜毅仁，徐子亮，项湜伍同志审定。

由于我们水平有限，时间仓促，错误之处在所难免，谨请读者批评指正。

编　者

1983年10月

# 目 录

## 前言

<b>第一章 随机存贮器</b> .....	( 1-1 )
2114A 1024×4 位静态随机存贮器.....	( 1-1 )
2115A、2125A 系列高速 1K×1 位静态随机存贮器 .....	( 1-5 )
2115H、2125H 系列高速 1K×1 位静态随机存贮器 .....	( 1-10 )
2118 系列 16384×1 位动态存贮器 .....	( 1-16 )
2128 2048×8 位静态随机存贮器 .....	( 1-30 )
2141 4096×1 位静态随机存贮器 .....	( 1-34 )
2142 1024×4 位静态随机存贮器 .....	( 1-42 )
2147A 高速 4096×1 位静态随机存贮器 .....	( 1-48 )
2147H 高速 4096×1 位静态随机存贮器 .....	( 1-54 )
2148H 1024×4 位静态随机存贮器 .....	( 1-60 )
2149H 1024×4 位静态随机存储器 .....	( 1-65 )
2164 系列 65,536×1 位动态随机存贮器 .....	( 1-69 )
2167 高速 16,384×1 位静态随机存贮器 .....	( 1-80 )
8148 4096×8 位集成随机存贮器 .....	( 1-86 )
2186/7 8192×8 位集成随机存贮器 .....	( 1-88 )
<b>第二章 只读存贮器</b> .....	( 2-1 )
2716 16K(2K×8)紫外线擦除 PROM .....	( 2-1 )
2732A 32K(4K×8)紫外线擦除PROM.....	( 2-8 )
2764 (8K×8)紫外线擦除PROM.....	( 2-15 )
27128 128K(16K×8)紫外线擦除PROM .....	( 2-22 )
2815 16K(2K×8)电擦除 PROM .....	( 2-23 )
2816 16K(2K×8)电擦除 PROM .....	( 2-35 )
2817 16K(2K×8)电擦除 PROM .....	( 2-49 )
3628A 8K(1K×8)双极型 PROM .....	( 2-50 )
3632 32K(4K×8)双极型 PROM .....	( 2-53 )
3636B 16K(2K×8)双极型 PROM.....	( 3-56 )
82S181/82HS181 8K(1K×8)双极型PROM.....	( 2-59 )
82S191/82HS191 16K(2K×8)双极型PROM .....	( 2-62 )
82S321/82HS321 32K(4K×8)双极型PROM .....	( 2-65 )
<b>第三章 磁泡</b> .....	( 3-1 )
BPK70 1M 位磁泡存贮器子系统 .....	( 3-1 )
BPK72 磁泡存贮器样机套件 .....	( 3-3 )

7110	1M 位磁泡存贮器	( 3-5 )
7220-1	磁泡存贮器的控制器	(3-13)
7230	磁泡存贮器用电流脉冲发生器	(3-31)
7242	磁泡存贮器用的二元格式器/检测放大器	(3-36)
7250	磁泡存贮器用线圈前置驱动器	(3-48)
7254	磁泡存贮器用四芯 VMOS 驱动晶体管	(3-52)
<b>第四章 电话和信号处理</b>		( 4-1 )
2910A	PCM 编码/解码器— $\mu$ 原则, 8 位 A/D 和 D/A 组合变换器	( 4-1 )
2911A	PCM 编码/解码器—A 原则, 8 位 A/D 和 D/A 组合变换器	(4-19)
2912A	PCM 发送/接收滤波器	(4-35)
2913/2914	组合单芯片 PCM 编码/解码器和滤波器	(4-48)
2920/2921	信号处理器	(4-66)
<b>第五章 HMOS 单片八位微计算机</b>		( 5-1 )
P80A49H/P80A39HL	HMOS 单片 8 位微计算机	( 5-1 )
P80A48L	HMOS 单片 8 位微计算机组件	(5-11)
P80A48H/P80A35HL	HMOS 单片 8 位微计算机	(5-21)
<b>第六章 MCS-48<sup>TM</sup> 系列单片微计算机</b>		( 6-1 )
8020H	HMOS 单片 8 位微计算机	( 6-1 )
8021	单片 8 位微计算机	( 6-9 )
8021H	HMOS 单片 8 位微计算机	(6-10)
8022	带有 A/D 转换器的单片 8 位微计算机	(6-21)
8022H	带有 A/D 转换器的高性能单片 8 位微计算机	(6-29)
8031/8051/8751	单片 8 位微计算机	(6-31)
8048H/8048H-1/8035HL/8035HL-1	HMOS 单片 8 位微计算机	(6-50)
80C48/80C35	CHMOS 单片 8 位微计算机	(6-60)
8748H/8035H	HMOS 单片 EPROM 微计算机	(6-68)
8049H/8039HL	HMOS 单片 8 位微计算机	(6-78)
80C49/80C39	CHMOS 单片 8 位微计算机	(6-86)
8749H/8749H-8/8039H/8039H-8	HMOS 单片 EPROM 微计算机	(6-94)
8243	MCS-48 <sup>R</sup> 输入/输出扩展器	(6-105)
8050H/8040H	HMOS 单片 8 位微计算机	(6-111)
<b>第七章 MCS-80/85<sup>TM</sup> 系列微计算机</b>		( 7-1 )
8080A/8080A-1/8080A-2	8 位 N 沟道微处理器	( 7-1 )
8085AH/8085AH-2/8085AH-1	8 位 HMOS 微处理器	(7-12)
8085A/8085A-2	单片 8 位 N 沟道微处理器	(7-31)
8155H/8156H/8155H-2/8156H-2	具有输入/输出转接口和计时器的 2048 位静态 HMOS 随机存贮器	(7-35)
8155/8156/8156-2/8156-2	具有输入/输出转接口和计时器的 2048 位静态 MOS 随机存贮器	(7-48)

8185/8185-2 为 MCS-85 的 1024×8 位静态随机存贮器	(7-51)
8205 高速 8 选 1 二进制译码器	(7-57)
8212 8 位输入/输出转接口	(7-63)
8216/8226 4 位并行双向总线驱动器	(7-73)
8218/8219 适用于 MCS-80 和 MCS-85 系列的双向微型计算机总线控制器	(7-77)
8224 适用于 8080A CPU 的时钟发生和驱动器	(7-88)
8228/8238 用于 8080A CPU 的系统控制器和总线驱动器	(7-93)
8237A/8237A-4/8237A-5 高性能、可编程序 DMA 控制器	(7-97)
8257/8257-5 可编程序直接存贮器存取(DMA)控制器	(7-116)
8259A/8259A-2/8259A-8 可编程序中断控制器	(7-137)
带有输入/输出的 8355/8355-2 16384 位 ROM	(7-158)
带有输入/输出电路的 16, 384 位可擦除可编程序的只读存贮器(EPROM)	
8755A/8755A-2	(7-167)
<b>第八章 iAPX 86, 88 微计算机</b>	(8-1)
iAPX 86/10 16 位 HMOS 微处理器 8086/8086-2/5086-1	(8-1)
iAPX 88/10 8 位 HMOS 微处理器 8088/8088-2	(8-28)
8089 8/13 位 HMOS 输入输出处理器	(8-56)
iAPX 86/20, 88/20 数值处理器	(8-74)
iAPX 86/30, iAPX 88/30 操作系统处理器	(8-93)
8282/8283 八位锁存器	(8-116)
8284A/8284A-1 iAPX 86, 88 处理器用时钟发生器和驱动器	(8-120)
8286/8287 八位总线收发器	(8-128)
8288 iAPX 86, 88 处理器用总线控制器	(8-132)
8289 总线裁决器	(8-140)
<b>第九章 微计算机外围器件</b>	(9-1)
<b>一、从处理器</b>	
8041AH/8041AH-2/8641A/8741A 通用外围接口 8 位微计算机	(9-1)
8042/8742 通用外围接口 8 位微计算机	(9-17)
8231A 算术处理部件	(9-33)
8232 浮点处理部件	(9-47)
8294 数据保密部件	(9-61)
8295 点阵打印机控制器	(9-74)
<b>二、存贮器控制器</b>	
8202A 动态 RAM 控制器	(9-87)
8203 64K 动态 RAM 控制器	(9-102)
8205 检错和纠错单元	(9-118)
8271/8271-6 可编程序软盘控制器	(9-137)
8272 单/双密度软盘控制器	(9-171)
<b>三、数据通讯</b>	

8251A 可编程序通讯接口 .....	(9-197)
8256 多功能通用异步接收发送器(MUART) .....	(9-218)
8273, 8273-4, 8273-8 可编程 HDLC/SDLC 规程控制器.....	(9-231)
8274 多规程串行控制器(MPSC) .....	(9-263)
8291A 仪器仪表通用接口总线(GPIB)讲者/听者接口 .....	(9-298)
8292 仪器仪表通用接口总线控者接口 .....	(9-331)
8293 仪器仪表通用接口总线收发器.....	(9-350)
<b>四、控制器件</b>	
8253/8253-5 可编程序区间计数器 .....	(9-364)
8254 可编程间隔定时器 .....	(9-377)
8255A/8255A-5 可编程序的外围接口 .....	(9-396)
8275 可编程序 CRT 控制器 .....	(9-419)
8276 小系统 CRT 控制器 .....	(9-447)
8279/8270-5 可编程序键盘/显示器接口 .....	(9-469)
<b>第十章 iAPX432 微主机系统 .....</b>	<b>( 10-1 )</b>
iAPX 43201/43202/43203 VLSI 微主机系统 .....	( 10-1 )
iAPX 43201, 43202 VLSI 通用数据处理器 .....	( 10-3 )
iAPX 43203 VLSI 接口处理器.....	(10-32)
<b>第十一章 工业级产品(附录一) .....</b>	<b>( 11-1 )</b>
<b>第十二章 军级产品(附录二) .....</b>	<b>( 12-1 )</b>
<b>第十三章 质量保证 .....</b>	<b>( 13-1 )</b>
<b>第十四章 通用信息 .....</b>	<b>( 14-1 )</b>

# 第一章 随机存贮器

## 2114A 1024×4位静态随机存贮器(SRAM)

	2114AL-1	2114AL-2	2114AL-3	2114AL-4	2114AL-4	2114AL-5
最大存取时间(ns)	100	120	150	200	200	250
最大电流(mA)	40	40	40	40	70	70

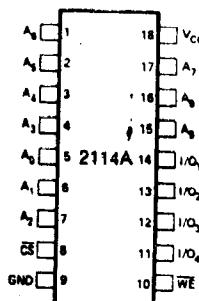
### ■ HMOS 工艺

- 全静态存贮器，不需要时钟或定时选通脉冲
- 低功耗，高速度
- 所有输入输出端都与 TTL 兼容
- 工作周期和存取时间相同
- 单电源 +5V ± 10% 容差
- 使用三态输出，数据的输入输出端共用
- 高密度、18 条引脚封装
- 2114 的升级产品

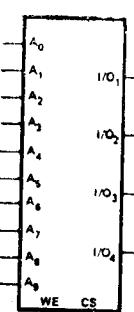
Intel 2114A 是一种 4096 位静态随机存贮器，结构为  $1024 \times 4$  位，采用高性能的 HMOS 工艺。存贮器阵列和译码电路均采用全直流静态电路，因而无时钟或刷新的要求。由于几乎不需要地址建立时间，因而数据存取就特别简单。数据采取非破坏性读出，而且与输入极性相同。输入输出都是共用一个引脚。

2114A 是采用高性能和高可靠性的 HMOS 工艺，低成本、存贮容量大、输入/输出接口简单，是它重要的设计目标。2114A 采用最高密度的 18 条引脚封装。

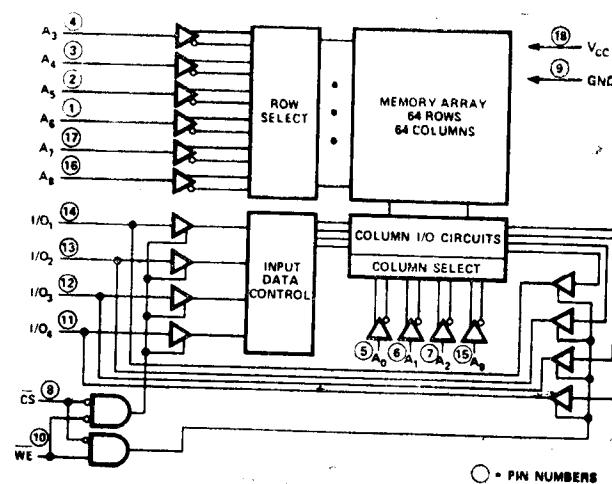
引脚图



逻辑符号



方框图



○ PIN NUMBERS

它在输入、输出，以及单 +5V 电源等方面均直接与 TTL 兼容。当很多 2114 的输出端是“或”连接时，由选片(CS)很容易分别选择其中的某一片 2114。

#### 引脚名称

A <sub>0</sub> ~A <sub>9</sub> 地址输入	V <sub>CC</sub> 电源(+5V)
WE 允许写	GND 地
CS 片选	
I/O <sub>1</sub> ~I/O <sub>4</sub> 数据输入/输出	

#### 极限参数\*

温度(加偏压).....	-10 °C 到 +80 °C
存放温度.....	-6.5 °C 到 +150 °C
任一引脚对地的电压.....	-3.5V 到 +7V
功耗.....	1.0W
直流输出电流.....	5mA

\*注：超出“极限参数值”可能使器件永久性损坏。它们仅仅是一些提请注意参数，但不允许实际去使用，因为长期工作在这种极限参数下会影响器件的可靠性。

#### 直流参数和工作特性

(除另说明外 T<sub>A</sub> = 0 °C 到 70 °C, V<sub>CC</sub> = 5V ± 10%)

符 号	参 数	2114AL-1/L-2/L3/L-4 最 小    典型 <sup>[1]</sup> 最 大	2114A-4/-5 最 小    典型 <sup>[1]</sup> 最 大	单 位	条 件
I <sub>LI</sub>	输入负载电流 (全部输入脚)	10	10	μA	V <sub>IN</sub> = 0 to 5.5V
I <sub>LO</sub>	I/O 漏电流	10	10	μA	CS = V <sub>IH</sub> V <sub>I/O</sub> = GND to V <sub>CC</sub>
I <sub>CC</sub>	电源电流	25    40	50    70	mA	V <sub>CC</sub> = max, I <sub>I/O</sub> = 0mA T <sub>A</sub> = 0 °C
V <sub>IL</sub>	输入低电平	-3.0    0.8	-3.0    0.8	V	
V <sub>IH</sub>	输入高电平	2.0    6.0	2.0    6.0	V	
I <sub>OL</sub>	输出低电流	2.1    9.0	2.1    9.0	mA	V <sub>OL</sub> = 0.4V
I <sub>OH</sub>	输出高电流	-1.0    -2.5	-1.0    -2.5	mA	V <sub>OH</sub> = 2.4V
I <sub>OS</sub> <sup>[2]</sup>	输出短路电流	40	40	mA	

注：1. 典型值是 T<sub>A</sub> = 25 °C, V<sub>CC</sub> = 5.0V 时测得的。

2. 持续时间不超过 30 秒。

#### 电容(T<sub>A</sub> = 25 °C, f = 1.0 MHz)

符 号	测 试	最 大 值	单 位	条 件
C <sub>I/O</sub>	输入/输出电容	.5	pF	V <sub>I/O</sub> = 0V
C <sub>IN</sub>	输入电容	5	pF	V <sub>IN</sub> = 0V

注：这个参数是定期抽样，不是100%的测试。

## 交流测试条件

输入脉冲电平.....	0.8V 到 2.0V
输入脉冲前后沿.....	10ns
输入输出计时电平.....	1.5V
输出负载.....	1个TTL 门加 $C_L = 100\text{pF}$

## 交流特性

(除另作说明外  $T_A = 0^\circ\text{C}$  到  $70^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 5\text{V} \pm 10\%$ )

### 一、读周期<sup>[1]</sup>

符号	参数	2114AL-1 最小 最大	2114AL-2 最大 最小	2114AL-3 最小 最大	2114A-4/L-4 最小 最大	2114A-5 最小 最大	单位
$t_{RC}$	读周期时间	100	120	150	200	250	ns
$t_A$	存取时间		100	120	150	200	250
$t_{CO}$	“片选”到输出有效		70	70	70	70	ns
$t_{CX}$	“片选”到输出激励		10	10	10	10	ns
$t_{ORD}$	取消“片选”到输出三态		30	35	40	50	60
$t_{OHA}$	地址变化而输出保持		15	15	15	15	ns

### 二、写周期<sup>[2]</sup>

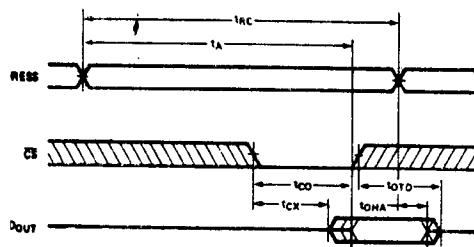
符号	参数	2114AL-1 min max	2114AL-2 min max	2114AL-3 min max	2114A-4/L-4 min max	2114A-5 min max	单位
$t_W$	写周期时间	100	120	150	200	250	ns
$t_W$	写入时间	75	75	90	120	135	ns
$t_{WR}$	写释放时间	0	0	0	0	0	ns
$t_{OTW}$	从写开始到输出三态		30	35	40	50	60
$t_{DW}$	写与数据的重叠时间	70	70	90	120	135	ns
$t_{DH}$	写入后到数据 保持的时间	0	0	0	0	0	ns

注解：1. 在  $\overline{CS}$  低电平与  $\overline{WE}$  高电平重叠期间发生读操作

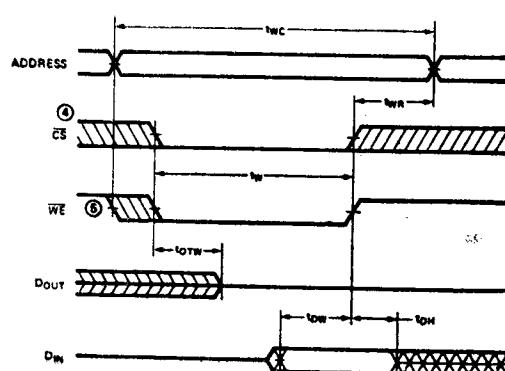
2. 在  $\overline{CS}$  低电平与  $\overline{WE}$  低电平重叠期间发生写操作。从  $\overline{CS}$ ， $\overline{WE}$  中较后的一个由高电平变低电平的后沿， $\overline{CS}$ ， $\overline{WE}$  中较前的一个由低电平变高电平的前沿之间测量  $t_{wq}$ 。

## 波形

### 读周期<sup>[3]</sup>



### 写周期



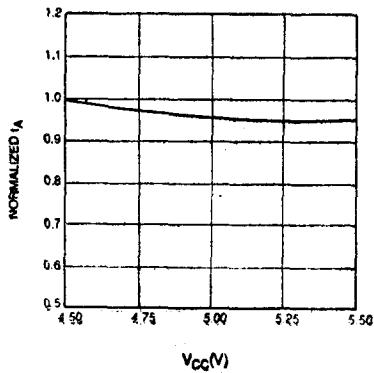
注解：3. 对读周期来说 WE 为高电平。

4. 如果 CS 变为低电平与 WE 变为低电平时同时发生，则输出缓冲器保持高阻抗状态。

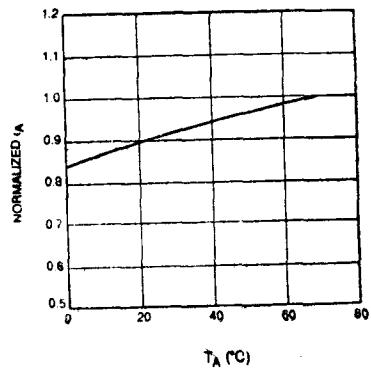
5. 在地址变化期间 WE 必须为高电平

## 典型的直流和交流特性

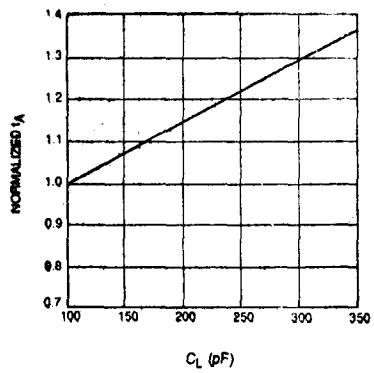
正常存取时间对电源电压的关系



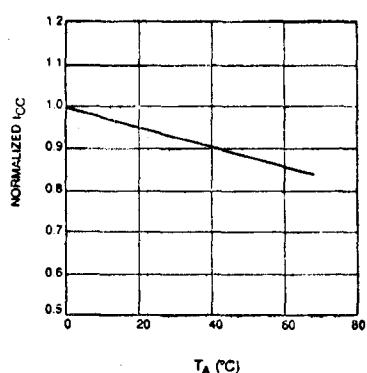
正常存取时间对环境温度的关系



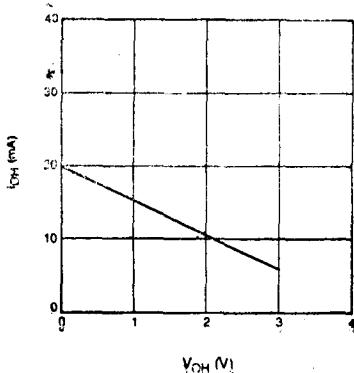
正常存取时间对输出负载电容的关系



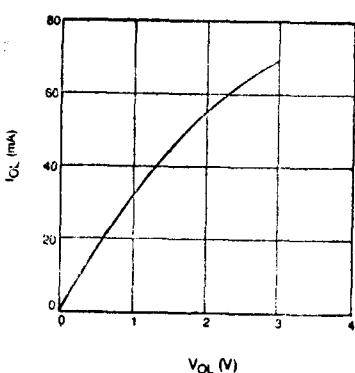
正常电源电流对环境温度的关系



输出电流与输出电压的关系



输出端吸收电流对输出电压关系



## 2115A、2125A 系列 高速 $1K \times 1$ 位静态随机存贮器

	2115AL, 2125AL	2115A, 2125A	2115AL-2, 2125AL-2	2115A-2, 2125A-2
最大值 TAA(ns)	45	45	70	70
最大值 Icc(mA)	75	125	75	125

- 引脚与 93415A(2115A)及 93425A(2125A)兼容
- 输入和输出都是 TTL 电平
- 单电源 +5V
- 10 个 TTL 扇出负载(2115A 系列), 输出端吸收电流为 16mA。
- 集电极开路(2115A)和三态(2125A)输出
- 低运行功耗—最大为 0.39mw/位(2115AL, 2125AL)
- 标准 16 条引脚双列直插式封装

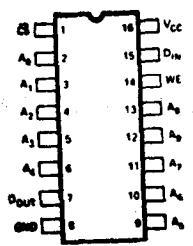
Intel 2115A 和 2125A 系列是  $1024 \times 1$  位的高速随机存储器。既可以集电极开路(2115A)也可以三态输出(2125A)。2115A 和 2125A 存储器阵列和译码均采用全直流静态电路。因而无时钟和刷新方面的要求。数据为非破坏性读出, 且与输入数据同极性。

最大存取时间为 45ns 的 2115AL/2125AL 及最大存取时间为 70ns 的 2115AL-2/2125AL-2 与双极型工业产品 RAM 是完全兼容的, 同时功率比双极型 RAM 要低 50%。2115AL/2125AL 及 2115AL-2/2125AL-2 的最大功耗是 394mw, 相当于最大功耗为 814mw 的双极型存储器。对于已经用 1K 双极型 RAM 设计的系统, 均可分别用最大存取时间为 45ns 的 2115A/2125A 及最大存取时间为 70ns 的 2115A-2/2125A-2 来代替, 并且其最大功耗还可以下降 20%。

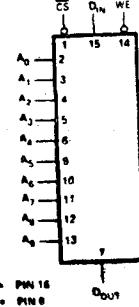
该器件在输入、输出以及单电源 +5V 等方面均直接与 TTL 兼容。当输出端有很多 2115A 或 2125A 并联使用时, 可由 (CS) 片选端来分别选择其中某一片电路。

2115A 和 2125A 系列是用 Intel 的 N 沟硅栅工艺制造的。

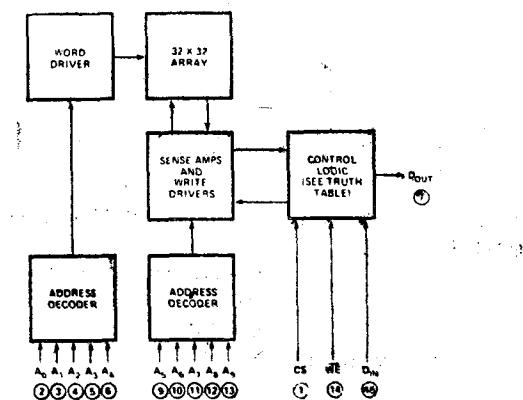
引脚图



逻辑符号



框 图



引脚名称

C S	片 选
A <sub>0</sub> ~A <sub>9</sub>	地址输入
WE	允许 写
D <sub>IN</sub>	数据输入
D <sub>OUT</sub>	数据输出

真值表

输入	输出 端 2115A 系列	输出 端 2125A 系列	状态
C S WE D <sub>IN</sub>	D <sub>OUT</sub>	D <sub>OUT</sub>	
H X X	H	HIGH Z	没选中
L L L	H	HIGH Z	写“0”
L L H	H	HIGH Z	写“1”
L H X	D <sub>OUT</sub>	D <sub>OUT</sub>	读

**极限参数\***

温度(加偏压)..... - 10 °C 到 + 85 °C

存放温度..... - 65 °C 到 + 150 °C

所有输出端或电源..... - 0.5V 到 + 7V

所有输入电压..... - 0.5V 到 + 5.5V

直流输出电流..... 20mA

\* 注：超出“极限参数值”可能使永久性损坏。它们仅仅是一些提请注意参数，但不允许实际去使用，因为长期工作在这种极限参数下会影响器件的可靠性。

**直流特性<sup>[1,2]</sup>**V<sub>CC</sub> = 5V ± 5%， T<sub>A</sub> = 0 °C 到 75 °C

符号	测 试	最 小	典 型	最 大	单 位	条 件
V <sub>OL1</sub>	2115A 系列输出低电平			0.45	V	I <sub>OL</sub> = 16mA
V <sub>OL2</sub>	2125A 系列输出低电平			0.45	V	I <sub>OL</sub> = 7mA
V <sub>IH</sub>	输入高电平	2.1			V	
V <sub>IL</sub>	输入低电平			0.8	V	
I <sub>IL</sub>	输入低电流		-0.1	-40	μA	V <sub>CC</sub> = Max, V <sub>IN</sub> = 0.4V
I <sub>IH</sub>	输入高电流		0.1	40	μA	V <sub>CC</sub> = Max, V <sub>IN</sub> = 4.5V
I <sub>CEx</sub>	2115A 系列输出漏电流		0.1	100	μA	V <sub>CC</sub> = Max, V <sub>OUT</sub> = 4.5V
I <sub>OFPF</sub>	2125 系列输出电流(高Z)		0.1	50	μA	V <sub>CC</sub> = Max, V <sub>OUT</sub> = 0.5V / 2.4V
I <sub>OS</sub> <sup>[3]</sup>	2125A 系列对地短路电流			-100	mA	V <sub>CC</sub> = Max
V <sub>OH</sub>	输出高电平	2.4			V	I <sub>OH</sub> = -3.2mA
I <sub>CC</sub>	电源电流 I <sub>CC1</sub> : 2115AL, 2115AL-2 I <sub>CC2</sub> : 2125AL, 2125AL-2		60	75	mA	所有输入接地，输出开路
	I <sub>CC1</sub> : 2115A, 2115A-2 I <sub>CC2</sub> : 2125A, 2125A-2		100	125	mA	

注：1. 工作时环境温度范围应保证横向空气流动超过400 呎/分，并在两分钟内启动。管壳最高值温度的典型热电阻值为：

$$\theta_{IA}(@400fPM \text{ air flow}) = 45^\circ\text{C}/\text{W}$$

$$\theta_{IA}(\text{still air}) = 60^\circ\text{C}/\text{W}$$

$$\theta_{IC} = 25^\circ\text{C}/\text{W}$$

2. 典型极限值是在V<sub>CC</sub> = 5V, T<sub>A</sub> = + 25 °C, 和最大负载时测得。

3. 短路电流的持续时间不得超过1秒。

**2115A 系列交流特性<sup>[1,2]</sup>  $V_{CC} = 5V \pm 5\%$ ,  $T_A = 0^\circ C$  到  $75^\circ C$**

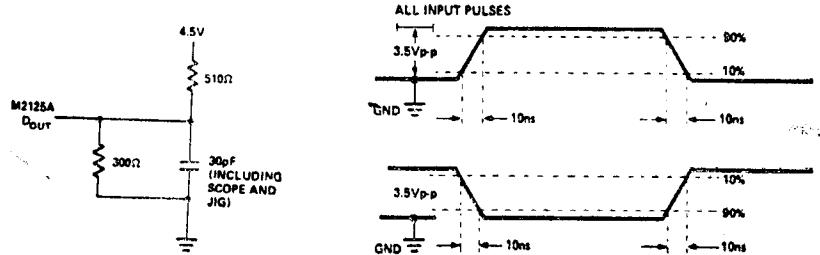
读周期

符号	测 试	2115AL Limits Min. Typ. Max.	2115A Limits Min. Typ. Max.	2115AL-2 Limits Min. Typ. Max.	2115A-2 Limits Min. Typ. Max.	Units
$t_{ACS}$	片选时间	5 15 30	5 15 30	5 15 30	5 15 40	ns
$t_{RCS}$	片选恢复时间	10 30	10 30	10 30	10 40	ns
$t_{AA}$	地址访问时间	30 45	30 45	40 70	40 70	ns
$t_{OH}$	地址变化以后 读出数据以前时间	10	10	10	10	ns

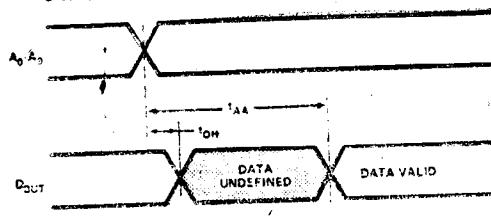
写周期

符号	测 试	Min. Typ. Max.	Min. Typ. Max.	Min. Typ. Max.	Min. Typ. Max.	Units
$t_{WS}$	允许写入时间	10 25	10 30	10 25	10 40	ns
$t_{WR}$	写恢复时间	0 25	0 30	0 25	0 45	ns
$t_w$	写脉冲宽度	30 20	30 10	30 15	50 15	ns
$t_{WSD}$	数据建立时间到写	0 -5	5 -5	0 -5	5 -5	ns
$t_{WHD}$	写入后数据保持时间	5 0	5 0	5 0	5 0	ns
$t_{WSA}$	地址建立时间	5 0	5 0	5 0	15 0	ns
$t_{WHA}$	地址保持时间	5 0	5 0	5 0	5 0	ns
$t_{WSCS}$	片选建立时间	5 0	5 0	5 0	5 0	ns
$t_{WHCS}$	片选保持时间	5 0	5 0	5 0	5 0	ns

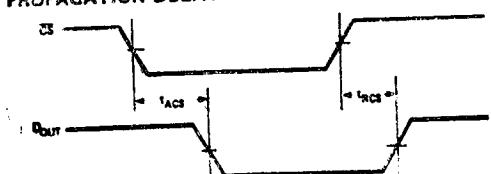
交流测试条件



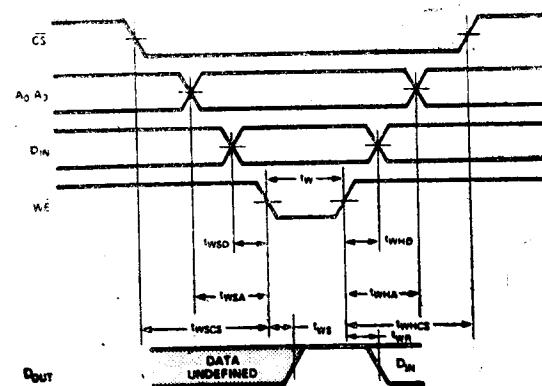
读周期



PROPAGATION DELAY FROM CHIP SELECT



写周期



上面所有的测量参考点为1.5V

## 2125 系列交流特性<sup>[1,2]</sup>

$V_{CC} = 5V \pm 5\%$ ,  $T_A = 0^\circ C$  到  $75^\circ C$

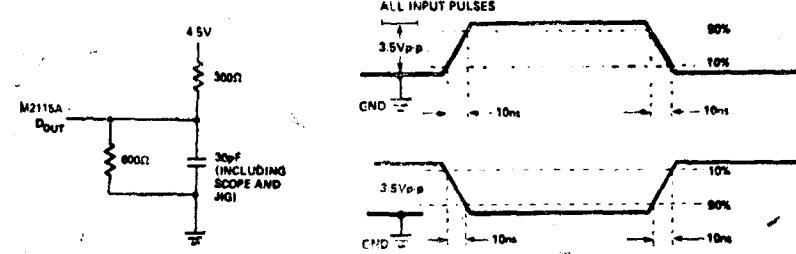
### 读周期

符号	测 试	2125AL Limits			2125A Limits			2125AL-2 Limits			2125A-2 Limits			Units
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
$t_{ACS}$	片选时间	5	15	30	5	15	30	5	15	30	5	15	40	ns
$t_{ZRCs}$	片选到高阻抗		10	30		10	30		10	30		10	40	ns
$t_{AA}$	访问地址时间		30	45		30	45		40	70		40	70	ns
$t_{OH}$	地址变化以后读出数据以前时间	10			10			10			10			ns

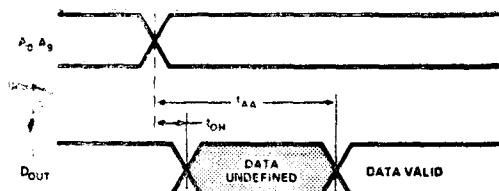
### 写周期

符号	测 试	Min. Typ. Max.			Units									
		Min.	Typ.	Max.										
$t_{ZWS}$	允许写到高阻抗		10	25		10	30		10	25		10	40	ns
$t_{WR}$	写恢复时间	0		25	0		30	0		25	0		45	ns
$t_w$	写脉冲宽度	30	20		30	10		30	10		50	15		ns
$t_{WSD}$	数据建立到写	0	-5		5	-5		0	-5		5	-5		ns
$t_{WHD}$	写入后数据保持时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns
$t_{WSA}$	地址建立时间	5	0		5	0		5	0		15	0		ns
$t_{WHA}$	地址保持时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns
$t_{WSCS}$	片选建立时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns
$t_{WHCS}$	片选保持时间	5	0		5	0		5	0		5	0		ns

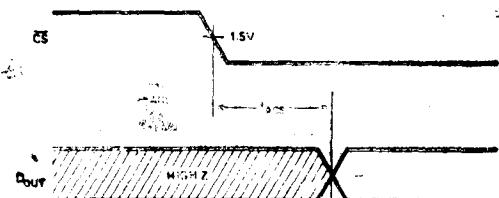
### 交流测试条件



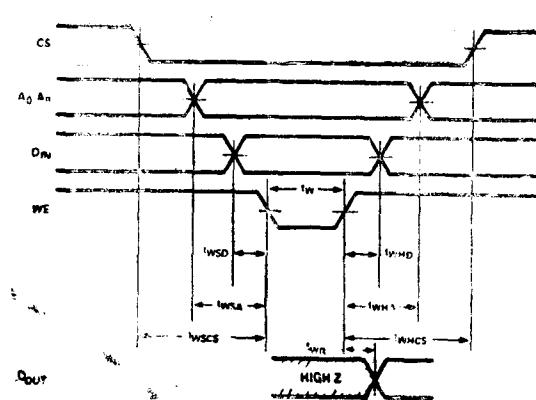
### 读周期



PROPAGATION DELAY FROM CHIP SELECT

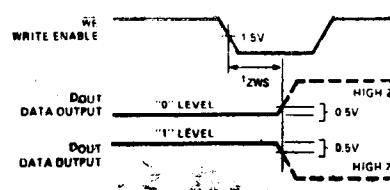
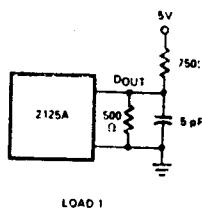


### 写周期

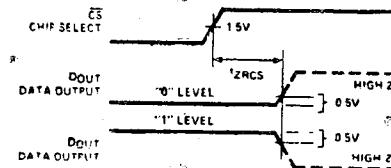


(以上所有测试参考点为1.5V)

## 2125 系列写启动到高阻抗的延时



## 2125 系列从片选到高阻抗的传输延时



ALL tZNS PARAMETERS ARE MEASURED AT A DELTA  
OF 0.5V FROM THE LOGIC LEVEL AND USING LOAD 1

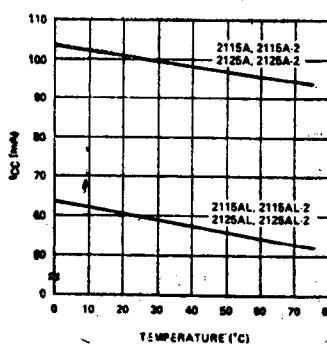
2115A/2125A 系列电容\* V<sub>CC</sub> = 5V, f = 1MHz, T<sub>A</sub> = 25°C

SYMBOL	TEST	2115A Family LIMITS		2125A Family LIMITS		UNITS	TEST CONDITIONS
		TYP.	MAX.	TYP.	MAX.		
C <sub>i</sub>	Input Capacitance	3	5	8	5	pF	All Inputs = OV, Output Open
C <sub>o</sub>	Output Capacitance	5	8	5	8	pF	C <sub>S</sub> = 5V, All Other Inputs = OV, Output Open

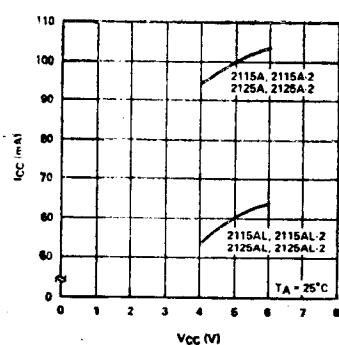
\*这参数是定期抽样并不是100%的测试。

## 典型特性

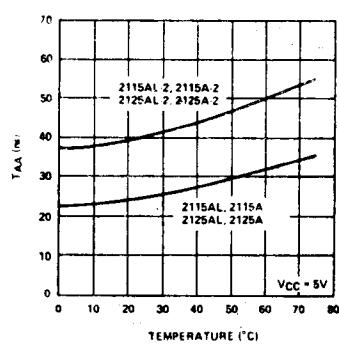
I<sub>CC</sub> VS. TEMPERATURE



I<sub>CC</sub> VS. V<sub>CC</sub>



ACCESS TIME VS. TEMPERATURE



## 2115H, 2115H 系列 高速 1K×1 位 静态随机存贮器(SRAM)

	2125H-1	2115H-2, 2125H-2	2115H-3, 2125H-3	2115H-4, 2125H-4
最大TAA(ns)	20	25	30	35
最大I <sub>cc</sub> (mA)	150	125	100	125

- HMOS I 工艺
- 所有输入输出端均与 TTL 兼容
- 引脚与 93415A(2115H)和 93425A(2125H)兼容
- 单电源 +5V
- 输出吸收电流为 16mA
- 集电极开路(2115H)和三态(2125H)输出
- 低运行功耗—最大为 0.53mW/位(2115H-3, 2125H-3)
- 标准 16 条引脚双列直插式封装

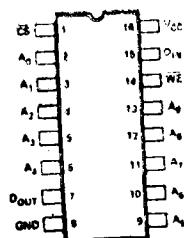
Intel 2115H 和 2125H 系列是  $1024 \times 1$  位的高速随机存取存储器，它是用 HMOS I 制造的(Intel 公司先进 N 沟硅栅 MOS 工艺)。既可以集电极开路(2115H)也可以三态输出(2125H)。存储器阵列和译码电路均采用全直流静态电路，因而无时钟或刷新方面的要求。数据为非破坏性读出，且与输入数据同极性。

HMOS I 的先进工艺使 1K 静态 RAM 的工业产品达到非常高的速度(存取时间只有 20ns)，而且功耗低。

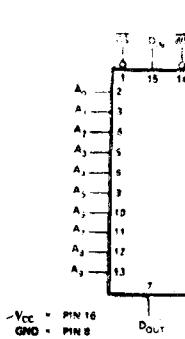
HMOS I 的 2115H/2125H 系列产品与 1K 双极型 RAM 完全兼容，而且功耗降低。最大功耗 525mv 和 656mw 与双极型 RAM 的 814mw 功耗相比分别降低了 19% 和 36%。

该器件在输入、输出以及单 +5V 电源等方面均直接与 TTL 兼容。当输出端有很多 2115H/2125H 并联时，选片(CS)很容易分别选择其中某一片 2115H/2125H。

引脚图



逻辑符号



方框图

